© 2012 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії

PACS numbers: 61.72.J-, 61.80.Jh, 61.82.Rx, 78.55.Hx, 78.67.Sc, 81.20.Fw, 81.40.Wx

Радіяційна модифікація власної дефектної структури плівок TiO₂ з наночастинками шляхетних металів

Т. О. Буско, М. П. Куліш, О. П. Дмитренко, В. С. Стащук, Н. В. Вітюк^{*}, А. М. Єременко^{*}

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, вул. Володимирська, 64, 01601 Київ, Україна *Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України, вул. Генерала Наумова, 17, 03164 Київ, Україна

Методою золь-ґель-синтези одержано тонкі нанокристалічні плівки TiO₂, TiO₂/Ag та TiO₂/Au, які опромінювалися йонами Ti⁺ ($E_i = 140$ кеВ з флюенсами 1·10¹²–5·10¹⁴ йон/см²). Методою спектральної еліпсометрії одержано спектральну залежність оптичної провідности $\sigma(E)$ плівок. Залежно від складу плівок нанокомпозитів спектер оптичної провідности $\sigma(E)$ має різний характер, обумовлений вбиранням світла за рахунок наявности власних дефектів структури: кисневих вакансій (F^{2+} -, F- і F^+ -центрів), йонів Ti³⁺ та міжвузлових атомів Ti. Спектри фотолюмінесценції плівок TiO₂, TiO₂/Ag, TiO₂/Au мають декілька компонент, пов'язаних з різними центрами випромінення, відносна інтенсивність яких змінюється залежно від дози опромінення. Фотокаталітична активність плівок до та після йонного опромінення визначалася з розкладу барвника родаміну Б. Перебудова електронного спектру в таких тонких плівках за рахунок власних дефектів структури анатазу може сприяти фотокаталітичній активності під дією УФ і видимого діяпазонів спектру.

Thin nanocrystalline TiO₂, TiO₂/Ag and TiO₂/Au films are fabricated, using the sol-gel synthesis method. Optical conductivity, $\sigma(E)$, is determined, using the spectral ellipsometry method. Depending on the makeup of the nanocomposite, optical conductivity $\sigma(E)$ differs characteristically due to light absorption caused by the presence of the structure intrinsic defects: oxygen vacancies (F^{2+} -, F- and F^+ -centres), Ti³⁺ ions, and interstitial Ti atoms. The photoluminescence spectra of TiO₂, TiO₂/Ag and TiO₂/Au films have several components, which correspond to different emission centres. The intensity of photoluminescence spectra depends on irradiation doses. The photocatalytic activity of films is determined by the Rhodamine B organic die degradation.

873

Rearrangement of the electronic spectrum caused by the aforementioned defects of anatase structure in such thin films can promote the photocatalytic activity in the UV and visible spectral ranges.

Методом золь-гель-синтеза были получены тонкие нанокристаллические плёнки TiO_2 , $TiO_2/Ag_1TiO_2/Au$, которые облучались ионами Ti^+ ($E_i = 140$ кэВ с флюенсом $10^{12} - 5 \cdot 10^{14}$ ион/см²). Методом спектральной эллипсометрии изучена оптическая проводимость σ(Е) плёнок. В зависимости от состава нанокомпозитов оптическая проводимость $\sigma(E)$ имеет разный характер, обусловленный поглощением света за счёт наличия собственных дефектов структуры: кислородных вакансий (F^{2+} -, F- і F^+ -центров), ионов Ті³⁺ и междоузельных атомов Ті. Спектры фотолюминесценции плёнок TiO_{2} , TiO_{2}/Ag , TiO_{2}/Au имеют несколько компонент, связанных с разными центрами излучения, относительная интенсивность которых изменяется в зависимости от дозы облучения. Фотокаталитическая активность плёнок до и после ионного облучения определялась по разложению красителя родамина Б. Перестройка электронного спектра в таких тонких плёнках за счёт собственных дефектов структуры анатаза может способствовать изменению фотокаталитической активности плёнок в УФ и видимом диапазонах спектра.

Ключові слова: плівки TiO₂, спектральна еліпсометрія, оптична провідність, фотолюмінесценція.

(Отримано 26 листопада 2012 р.)

1. ВСТУП

Ускладнення екологічної ситуації, обумовлене розширенням шкідливого виробництва, вимагає створення нових функціональних матеріялів, активних при знешкодженні йонів важких металів, ядрових відходів та інших токсичних забруднювачів. Такі матеріяли повинні бути стійкими в умовах аґресивних середовищ та підвищеній радіяції. Найбільш широковживаним фотокаталізатором, що використовується для знезараження забруднювачів навколишнього середовища, завдяки своїй високій ефективності і хемічній стабільності, є діоксид титану. Однак, робочим діяпазоном даного напівпровідника є УФ-частина спектру, тому його використання вимагає подальшого підвищення фотокаталітичної активности шляхом розширення области вбирання TiO₂ до видимого світла.

Значну роль у процесах релаксації електронного збудження, включаючи відокремлення носіїв зарядів, відіграють власні дефекти структури плівок і включення до них наночастинок шляхетних металів.

Внесення йонів срібла та золота в прекурсор діоксиду титану та подальше термооброблення плівок в атмосфері повітря при використанні методи золь-ґель-синтези призводить до кристалізації нано-

874

частинок TiO_2 у фазі анатазу та одночасного формування наночастинок металів. При цьому вдається синтезувати нанокомпозити з рівномірним розподілом у матриці наночастинок металів [1].

Особливе місце займає приготування методою золь-ґель-синтези непористих або мезопористих плівок фотокаталізаторів TiO_2 з шляхетними металами. Так, показано, що фотоактивність мезопористих плівок TiO_2/Ag перевищує активність плівок TiO_2 вдвічі. Однак, внаслідок нестабільности пористої структури в умовах аґресивних середовищ, наприклад, при радіяційному опроміненні, фотоактивність таких плівок може значним чином погіршуватись.

Високоенергетичне β -опромінення нанокомпозитних потрійних плівок TiO₂/ZrO₂/SiO₂ сприяє утворенню радіяційних дефектів, які виступають пастками електронів. За рахунок появи таких пасток уповільнюється час рекомбінації носіїв заряду і з'являються умови для їх відокремлення, що викликає підвищення фотокаталітичної активности одержаних композитів [2].

Внаслідок утворення дефектів структури в полях йонізівного опромінення, що завжди присутнє в сховищах ядрових відходів, в присутності фотокаталізаторів можливе відновлення та видалення токсичних йонів важких металів або інших речовин шляхом окиснювально-відновних процесів [3].

Разом з тим, активність діоксиду титану в умовах радіяційних полів може суттєво змінюватися при зростанні ввібраної дози. У зв'язку з цим важливим є дослідження дозової залежности різних бомбівних частинок, в тому числі йонів, на зміну фотокаталітичних властивостей даних матеріялів.

З іншого боку, окиснювально-відновні процеси, які відбуваються в плівках чистого TiO₂ та плівках з наночастинками шляхетних металів, значну роль відіграє швидкість рекомбінації фотоґенерованих носіїв зарядів. Тому викликає інтерес визначення впливу йонізівного опромінення на формування і радіяційну модифікацію центрів випромінення. Можна очікувати, що при певних умовах опромінення, в тому числі зі зміною дозового навантаження, в плівках може бути створений не лише оптимальний рівень радіяційних пошкоджень, а також певне співвідношення різних типів власних дефектів структури TiO₂ зі своїм набором локальних електронних станів у межах енергетичної щілини. Така радіяційно-стимульована електронна структура плівок TiO₂, яка реалізується через радіяційну модифікацію власних дефектів, очевидно буде впливати на можливості відокремлення зарядів та їх взаємної рекомбінації. Як наслідок, квантовий вихід фотолюмінесценції, обумовлений різним типом центрів випромінення, буде змінюватись, що може спричинити радіяційну модифікацію фотокаталітичних властивостей через вплив опромінення на механізми редокс-процесів. Особливу роль в зміні зарядового стану власних дефектів структури і, як наслідок, в модифікації електронної структури локальних енергетичних станів у межах забороненої зони можуть відігравати включення наночастинок шляхетних металів зі своїм набором електронних рівнів.

Дану роботу присвячено дослідженню оптичної провідности, фотолюмінесцентних та фотокаталітичних властивостей тонких плівок діоксиду титану, а також плівок TiO₂ з включеннями наночастинок срібла та золота. Також вивчено вплив опромінення йонами Ti⁺ ($E_i = 140$ кеВ з флюенсами, які змінювались від 1·10¹² до 1·10¹⁴ йон/см²) на оптичну провідність, фотолюмінесцентні властивості та фотокаталітичну активність плівок. Остання перевірялась на процесі фоторозкладу органічного барвника родаміну Б при освітленні системи барвник-фотокаталізатор УФ-світлом.

2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

У даній роботі непористі плівки діоксиду титану були синтезовані золь-ґель-методою з використанням тетраізопропоксиду титану Ti(OPr)₄, ацетил ацетону AcAc як стабілізатора та етилового спирту. Спочатку змішували 2 мл етилового спирту з 0,25 мл AcAc та додавали 0,84 мл Ti(OPr)₄. Після прегідролізи прекурсору протягом 1,5– 2 годин вводили невелику кількість води (0,2 мл) для повноти гідролізи. Для одержання плівок TiO₂/Ag до готового розчину вводили у відповідних кількостях розчин нітрату срібла у воді. Для одержання плівок TiO₂/Au до готового прекурсору додавали у відповідних кількостях розчин тетрахлороауратної кислоти. Одержаний прекурсор використовувався для нанесення плівок на попередньо очищені підкладки шляхом занурювання витягування зі швидкістю витягування 1,5 мм/с. Після нанесення плівки гідролізували на повітрі впродовж 2 год. і відпалювали в муфельній печі при 500°С (4 год.).

Спектри оптичної провідности (ОП) плівок були одержані методою спектральної еліпсометрії. На експерименті вимірювалися еліпсометричні параметри ψ та Δ і з них розраховувались оптичні сталі n і χ . Оптична провідність визначалась на основі оптичних сталих $\sigma(E) = n\chi v$ (v — частота світла). Експеримент виконувався при кімнатній температурі в діяпазоні 1–5 еВ при куті падання світла 72°.

Спектри фотолюмінесценції (ФЛ) одержувались у геометрії на відбивання при кімнатній температурі за допомогою потрійного спектрометра Horbia Jobin Yvon T64000, оснащеного охолоджуваним ССD-детектором. Для одержання спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) використовувалась лінія неперервного He–Cd-лазера з довжиною хвилі збудження λ_{36} = 325 нм. Опромінення йонами Ti⁺ виконувалося на йонному імплантаторі. Енергія йонів вибиралася рівною E = 140кеВ з різними флюенсами: 1·10¹², 1·10¹³, 1·10¹⁴, 5·10¹⁴ йон/см².

Фотокаталітичну активність зразків було досліджено шляхом реакції деструкції барвника родаміну Б (РБ) (N, N, N', N'-тетраетильродамін) під дією УФ-світла. Джерелом світла була живосрібна лямпа ПРК-1000. Фотоокиснення водного розчину барвника відбувалось у кварцовому реакторі з водяним охолодженням при доступі повітря. Контроль за вмістом родаміну Б відбувався за зміною оптичної густини розчину на довжині хвилі 554 нм (λ_{max}) під час опромінення. Константу швидкости реакції розраховували за формулою реакції першого порядку.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

3.1. Оптична провідність тонких плівок ТіО₂ та його композитів з наночастинками Ag, Au при йонному опроміненні

На рисунку 1 наведено спектральну залежність ОП $\sigma(E)$ для плівки TiO₂ до та після опромінення йонами Ti⁺ ($E_i = 140$ кеВ з флюенсом $1 \cdot 10^{12} - 5 \cdot 10^{14}$ йон/см²). Спектральна залежність ОП вказує на присутність низки міжзонних переходів, які містять не лише переходи, обумовлені особливими **k**-точками електронної будови фази анатазу TiO₂, а також переходи, обумовлені наявністю в енергетичній щілині локальних енергетичних рівнів, що відповідають присутності власних дефектів структури.

Наявність дефектів плівки TiO_2 виявляється у вигляді кількох смуг вбирання, в тому числі в області краю фундаментального вбирання. На кривій $\sigma(E)$ (рис. 1) видно кілька піків поблизу енергій 1,3, 1,57, 1,75, 1,95, 2,6 і 2,8 еВ. Оскільки край фундаментального вбирання для фази анатазу, як відомо, відповідає значенню E = 3,2



Рис. 1. Спектральна залежність оптичної провідности $\sigma(E)$ плівки TiO₂ до (1) і після йонного опромінення з флюенсами $1 \cdot 10^{12}$ (2), $1 \cdot 10^{13}$ (3), $1 \cdot 10^{14}$ (4), $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² (5). На вставці показано розклад на Ґавсові компоненти ОП $\sigma(E)$ плівки TiO₂ до опромінення в діяпазоні енергій фотонів світла 1,0–2,2 еВ.

eB [4], то вказані максимуми пов'язані з різними типами власних дефектів, характерними для структури TiO₂.

При опроміненні плівок значення ОП, зумовлене наявністю дефектів, енергетичні рівні яких відповідають незначним енергіям, майже не змінюються, а для дефектів, енергія яких близька до краю вбирання $\sigma(E)$, зменшуються.

Варто звернути увагу на асиметричний вигляд розглянутих смуг $\sigma(E)$, що дозволяє виділити кілька компонент (вставка на рис. 1). Їх наявність свідчить про складний характер електронної будови в межах забороненої зони TiO₂, пов'язаний з присутністю широкого набору різноманітних дефектів структури. Як правило, розглядають можливість існування в TiO₂ кисневих вакансій, які можуть утворювати три типи F^{2+} -, F^+ -, F-центрів [5], йонів Ti³⁺ [6], міжвузлових атомів Ti у тетраедричних i_{τ} (Ti) і октаедричних i_{o} (Ti) порах тетрагональної ґратниці анатазу [7]. Всі вони виявляються як результат значного зростання густини електронної спектроскопії показано, що кисневим вакансіям з різним числом захоплених електронів відповідають енергії рівні 1,17, 2,55 і 2,81 еВ, а йонам Ti³⁺ енергетичний стан з енергією 2,0 еВ [8]. Відповідно до вказаних до-



Рис. 2. Розклад на Ґавсові компоненти спектральної залежности оптичної провідности $\sigma(E)$ плівки ТіО₂ після йонного опромінення з флюенсами $1 \cdot 10^{12}$ (*a*), $1 \cdot 10^{13}$ (*б*), $1 \cdot 10^{14}$ (*в*), $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² (*г*).

сліджень, смуги $\sigma(E)$ також можуть бути віднесені до переходів, пов'язаних з присутністю вказаних дефектів (табл. 1). Опромінення йонами з різними флюенсами призводить до суттєвої перебудови спектрів ОП $\sigma(E)$ як в області **k**-точок, так і в межах забороненої зони TiO₂. При найменшому флюенсі ($1 \cdot 10^{12}$ йон/см²) спостерігається різке падання ОП в області енергій, де відбуваються переходи, обумовлені існуванням заряджених F^+ -, F-центрів. Це означає, що концентрація вказаних центрів вбирання суттєво зменшується. При вказаному флюенсі також має місце перебудова спектрів $\sigma(E)$ в інтервалі енергій, де вбирання пов'язане з іншими типами дефектів (рис. 2, табл. 1).

Якщо значення ОП σ для кисневих вакансій F^{2+} майже не змінилось, то для дефектів i_{o} (Ті) воно збільшилось при зростанні флюенсу до $1 \cdot 10^{13}$ йон/см². Також максимум ОП, обумовлений дефектами F^{2+} , зміщується в бік менших енергій, а його інтенсивність зменшується.

ТАБЛИЦЯ 1. Значення енергій електронних переходів, обумовлених наявністю власних дефектів структури в плівках TiO_2 до та після радіяційного опромінення, та властиві їм значення оптичної провідности σ .

Величина	Тип власних	Енергія	Оптична	
флюенсу,	дефектів	електронних	провідність	
йон/см 2	структури ${ m TiO}_2$	переходів, еВ	$\sigma \cdot 10^{15}$, c ⁻¹	
	F^{2+}	1,3	0,5	
	i _o (Ti)	1,57	0,45	
	$i_{\rm T}({\rm Ti})$	1,75	0,95	
0	${ m Ti}^{3+}$	1,95	0,7	
	F^+	2,6	1,5	
	F	2,8	2,5	
	F^{2+}	1,27	0,4	
1 10 ¹²	$i_{\rm r}({\rm Ti})$	1,72	0,6	
1.10	Ti^{3+}	1,97	0,5	
	F^+	2,3	0,3	
	F^{2+}	1,25	0,25	
1 1013	$i_{o}(Ti)$	1,65	0,4	
1.10	Ti^{3+}	1,9	0,7	
	F^+	2,3	0,25	
$1 \cdot 10^{14}$	F^{2+}	1,2	0,35	
	i _o (Ti)	1,35	0,25	
	$i_{\rm T}({\rm Ti})$	1,7	0,35	
	${ m Ti}^{3+}$	1,9	0,8	
	F^{+}	2,17	0,3	
5.10^{14}	F^{2+}	1,2	0,45	
	$i_{o}(Ti)$	1,4	0,9	
	Ti^{3^+}	1,95	0,5	
	F^+	2,1	0,9	

Різке зменшення ОП при несуттєвому зміщенні піків $\sigma(E)$ і значній перебудові спектрів відбувається при подальшому зростанні флюенсу.



Рис. 3. Спектральна залежність оптичної провідности $\sigma(E)$ плівки TiO₂/Ag до (1) та після йонного опромінення з флюенсами 1·10¹² (2), 1·10¹³ (3), 1·10¹⁴ (4), 5·10¹⁴ йон/см² (5).



Рис. 4. Розклад на Ґавсові компоненти спектральної залежности оптичної провідности $\sigma(E)$ плівки TiO₂/Ag після йонного опромінення з флюенсами $1 \cdot 10^{13}$ (*a*), $1 \cdot 10^{14}$ (б), $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² (*в*).

Очевидно, що розглянута перебудова спектрів $\sigma(E)$, особливо при малих дозах вбирання йонного опромінення, може значно впливати на фотоґенерацію і релаксацію збуджених носіїв заряду. Останнє може суттєво виявлятися на фотокаталітичних властивостях плівок TiO₂.

Включення до наноструктурних плівок TiO₂ наночастинок Ag призводить до значної перебудови спектру ОП $\sigma(E)$. В області енергій 1,0-3,0 eB для неопроміненої та опроміненої флюенсом 1·10¹² йон/см² плівки TiO_2/Ag немає жодних смуг ОП, а при більших енергіях з'являється смуга вбирання, яка виникає як результат перекриття смуги вбирання F^+ -, F-центрів з непрямим міжзонним переходом $X_{1a} \to \Gamma_3$ [9, 10]. Водночас, вбирання, пов'язане з присутністю інших типів дефектів, не спостерігається. Для плівки TiO₂/Ag збільшення флюенсу призводить до кардинальної перебудови спектральної поведінки ОП $\sigma(E)$. По-перше, значно зростає величина ОП для опромінених плівок TiO_2/Ag у порівнянні з плівками TiO_2 . По-друге, суттєво збільшується інтенсивність вбирання поблизу краю фундаментального вбирання. Особливо значне зростання ОП у цій області виникає при флюенсі 1 10¹⁴ йон/см². Крім того, спостерігається суттєве підвищення ОП в області енергій існування дефектів F^{2+} і Ti^{3+} , *i*_o(Ti), *i*_т(Ti) (рис. 3).

У випадку флюенсу опромінення $1 \cdot 10^{14}$ йон/см² інтенсивність смуги ОП в інтервалі енергій 1,0–2,6 еВ значно перевищує її значення при інших флюенсах. Розклад ОП на компоненти у вказаному інтервалі енергій дозволяє виділити внески, обумовлені дефектами i_0 (Ti), i_{π} (Ti) (рис. 4, табл. 2).

Для плівки TiO₂/Ag при флюенсі $1 \cdot 10^{13}$ йон/см² ОП, яка відповідає дефектам i_{o} (Ti), досягає значення $12 \cdot 10^{15}$ с⁻¹, а у випадку флюенсу $1 \cdot 10^{14}$ йон/см² ОП зростає до величини $45 \cdot 10^{15}$ с⁻¹.

Інтенсивність смуги поблизу краю фундаментального вбирання

ТАБЛИЦЯ 2. Значення енергій електронних переходів, обумовлених наявністю власних дефектів структури в плівках TiO_2/Ag до та після радіяційного опромінення, та властиві їм значення оптичної провідности $\sigma(E)$.

Величина	Тип власних	Енергія	Оптична
флюенсу.	дефектів	електронних	провідність
йон/см ²	структури TiO_2	переходів, еВ	$\sigma \cdot 10^{15}, c^{-1}$
	F^{2+}	1,1	1,4
$1 \cdot 10^{13}$	$i_{o}(Ti)$	1,5	12
	Ti^{3+}	1,95	2,7
$1 \cdot 10^{14}$	$i_{o}(Ti)$	1,4	45
	$i_{\rm T}$ (Ti)	1,6	6,5
$5 \cdot 10^{14}$	F^{2^+}	1,2	9,8
	$i_{\rm o}({\rm Ti})$	1,5	2,75

зі збільшенням флюенсу до $1 \cdot 10^{14}$ йон/см² також зростає, а при флюенсі $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² навпаки зменшується. Фон оптичної провідности біля краю вбирання, який може бути віднесений до наявности дефектів F^+ , F, із зростанням флюенсу зменшується.

Поведінка ОП плівки TiO₂/Au (рис. 5) подібна до спектральної залежности $\sigma(E)$ плівки TiO₂/Ag, що виявляється у виникненні піків вбирання, обумовлених кисневими вакансіями F^+ -, F-типів, енергія



Рис. 5. Спектральна залежність оптичної провідности $\sigma(E)$ плівки TiO₂/Au до (1) та після йонного опромінення з флюенсами 1·10¹² (2), 1·10¹³ (3), 1·10¹⁴ (4), 5·10¹⁴ йон/см² (5).

Величина	Тип власних дефектів структури	Енергія	Оптична	
флюенсу, йон/см ²	TiO ₂	переходів, еВ	$\sigma \cdot 10^{15}, c^{-1}$	
0	$F^{2+},\ i_{ m o}({ m Ti})\ i_{ m r}({ m Ti})$	1,38 1,7	11 2,6	
$1 \cdot 10^{12}$	$i_{ m r}({ m Ti}) \ { m Ti}^{3+}$	$1,67 \\ 1,96$	10,6 0,3	
$1 \cdot 10^{13}$	$F^{2+} i_{ m o}({ m Ti})$	$1,34 \\ 1,58$	$7,36\\4,1$	
$1 \cdot 10^{14}$	$F^{2+}\ i_{ m o}({ m Ti})\ i_{ m r}({ m Ti})$	$1,2 \\ 1,4 \\ 1,6$	2,2 22 4,3	
$5 \cdot 10^{14}$	$F^{2+}\ i_{ m o}({ m Ti})\ i_{ m r}({ m Ti})$	1,2 1,4 1,6	$\begin{array}{c} 4\\ 21\\ 5\end{array}$	

ТАБЛИЦЯ 3. Значення енергій електронних переходів, обумовлених наявністю власних дефектів структури в плівках TiO_2/Au до і після радіяційного опромінення, та властиві їм значення оптичної провідности $\sigma(E)$.

яких близька до краю вбирання та власних дефектів інших типів, електронні рівні яких знаходяться в області низьких енергій.

При зростанні флюенсу смуги ОП ведуть себе складним чином. Так, для плівки TiO₂/Au найвище значення інтенсивности смуги поблизу краю вбирання відповідає неопроміненому зразку. З незначним зростанням флюенсу значення σ в максимумі смуги біля краю фундаментального вбирання падає до значень $\cong 15 \cdot 10^{15}$ с⁻¹. Подальше зростання флюенсу до $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² призводить до зменшення ОП у порівнянні з неопроміненою плівкою. При опроміненні плівки TiO₂/Au спостерігається суттєва перебудова її дефектної структури (табл. 3, рис. 6).



Рис. 6. Розклад на Ґавсові компоненти оптичної провідности $\sigma(E)$ плівки TiO_2/Au після йонного опромінення з флюенсами $1 \cdot 10^{12}$ (*a*), $1 \cdot 10^{13}$ (*b*), $1 \cdot 10^{14}$ (*b*), $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² (*c*).

Для неопроміненої плівки ТіО₂/Аи можливим є формування значної концентрації F^{2+} -центрів, але більш ймовірною є поява міжвузлових атомів Ті в обох типах пор i_0 (Ti), i_{T} (Ti). Опромінення з флюенсом $1 \cdot 10^{12}$ йон/см² супроводжується виникненням дефектів i_{r} (Ti), ${
m Ti}^{3+}$. При збільшенні флюенсу до $1\cdot 10^{13}$ йон/см 2 має місце зародження дефектів F^{2+} , i_{0} (Ti). Слід відмітити, що для плівки з наночастинками Au при збільшенні флюенсу величина оптичної провідности, що відповідає дефектам F^{2+} , зростає. З одержаних спектральних залежностей ОП видно, що суттєву роль в їх трансформації відіграють зміни в концентрації дефектів F^+ - і F-типів, а також радіяційна модифікація інших дефектів з низькою енергією електронних рівнів, особливо F^{2+} -центрів. Можна припустити, що перебудова електронної структури локалізованих енергетичних рівнів у межах забороненої зони є наслідком одночасної дії радіяційного опромінення на дефектоутворення F^+ - і F-центрів і транспорту від них електронів до наночастинок шляхетних металів, що відіграють роль пасток внаслідок значного бар'єру Шотткі на межі поділу металевих та оксидних наноструктур. Перенесення електронів до наночастинок металів призводить до зміни типу F-центрів, що супроводжується перебудовою електронної структури дефектних станів.

Очевидно, що вказана перебудова електронної структури буде впливати на процеси релаксації електронних збуджень і, як наслідок, на фотолюмінесценцію таких нанокомпозитів, модифікованих радіяційним опроміненням.

3.2. Фотолюмінесценція тонких плівок TiO_2 , TiO_2/Ag , TiO_2/Ag , TiO_2/Au при йонному опроміненні

Спектри фотолюмінесценції для плівки TiO_2 представляють широку смугу в області 1,9–2,75 eB, що вказує на присутність кількох механізмів випромінення (рис. 7).

Розклад спектрів фотолюмінесценції на компоненти дозволяє виділити складові, обумовлені рекомбінацією автолокалізованих екситонів та присутністю поверхневих станів. Зі спектрів фотолюмінесценції видно, що радіяційна модифікація плівок TiO_2 викликає не лише загальне гасіння інтенсивности фотолюмінесценції, а також гасіння інтенсивности смуги, яка відповідає рекомбінації автолокалізованих екситонів, зумовленій спотворенням октаедра TiO_6 . Останнє можливе як за рахунок зміщення атомів Ti та O, так і внаслідок зміни їх йонного стану, що виявляється на міжатомових зв'язках в октаедрі TiO_6 . Характер спотворень TiO_6 , в свою чергу, впливає на можливість автолокалізації екситонів і, таким чином, на зростання ймовірности виходу фотоґенерованих зарядів на поверхню, що в подальшому може сприяти підвищенню фотокаталітичної активности $\text{TiO}_2[11]$.



Рис. 7. Спектри фотолюмінесценції плівки TiO_2 у вихідному стані до (1) та після йонного опромінення з флюенсами $1 \cdot 10^{12}$ (2), $1 \cdot 10^{13}$ (3), $1 \cdot 10^{14}$ (4), $1 \cdot 10^{15}$ йон/см² (5).

Подібне гасіння спектрів фотолюмінесценції також спостерігається при електронному опроміненні [12]. Виявляється, що найменшою є інтенсивність спектру при електронному опроміненні з незначною дозою вбирання 0,5 МГр. При цьому було встановлено, що електронне опромінення сприяє збільшенню концентрація йонів Ti³⁺ та кисневих вакансій, що сприяє зменшенню електрон-діркової рекомбінації, ширини забороненої зони, а також спричиняє переміщення атомів вуглецю до поверхні, що, в свою чергу, покращує фотоактивність поверхні плівок TiO₂ [12].

Падання інтенсивности ФЛ при йонному опроміненні також свідчить про зменшення рекомбінації електрон-діркових пар. Разом з тим, слід відмітити, що внаслідок опромінення змінюється не лише компонента випромінення, обумовлена автолокалізованими станами, а також компонента, пов'язана з поверхневими станами.

З підвищенням радіяційної дози опромінення відбувається ґенерування нових пар електрон–дірка та поступове підвищення інтенсивности ФЛ-спектрів. Крім того, підвищення концентрації Ті³⁺ центрів на поверхні каталізатора також сприяє зростанню інтенсивності ФЛ-спектрів.

Таким чином, можна припустити, що дефектним станам на поверхні каталізатора відповідають йони Ti^{3+} і кисневі вакансії. Останні, як відомо, підвищують хемічну адсорбцію кисню і тому сприяють фотоактивності TiO_2 [12]. Варто звернути увагу, що за менших значень флюенсу інтенсивність фотолюмінесценції зростає, і лише за більших його величин має місце її гасіння. При опроміненні найбільшим флюенсом ($5 \cdot 10^{14}$ йон/см²) інтенсивність фотолюмінесценції зростає в порівнянні з інтенсивністю при флюенсі $1 \cdot 10^{14}$ йон/см². Це свідчить про складний характер релаксації електронних збу-

джень у таких плівках, який зумовлений радіяційними пошкодженнями структури при різних дозах вбирання йонного опромінення. Як встановлено, спектер фотолюмінесценції плівок TiO_2 формується за рахунок наявности автолокалізованих екситонів при енергії 2,58 еВ та поверхневих станів при 2,28 і 2,08 еВ. Останні пов'язані з присутністю на поверхні нанокристалів TiO_2 заряджених кисневих вакансій F^+ і F[11].

Через складний характер змін фотолюмінесценції доцільно розглянути, яким чином на таку перебудову спектру емісії впливають



Рис. 8. Розклад на Ґавсові компоненти спектрів фотолюмінесценції плівки TiO₂ до (*a*) та після йонного опромінення з флюенсами $1 \cdot 10^{12}$ (*b*), $1 \cdot 10^{13}$ (*b*), $1 \cdot 10^{14}$ (*c*), $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² (*d*).

окремі компоненти дефектної структури плівок.

На рисунку 8 наведено розклад на окремі компоненти спектрів фотолюмінесценції плівки TiO_2 до та після йонного опромінення з різними флюенсами. Енергії максимумів компонент вказують, що спектер ФЛ обумовлений присутністю на поверхні йонів Ti^{3+} та кисневих вакансій F^+ і F. Крім того, одна з компонент випромінення з максимумом поблизу 2,49 eB відповідає рекомбінації автолокалізованих екситонів. Енергія максимуму компоненти, обумовленої Ti^{3+} , дорівнює 1,85 eB. Для заряджених кисневих вакансій максимуми відповідають енергіям 2,05 eB (F^+) і 2,23 eB (F).

Залежно від флюенсу інтенсивність випромінення від кожного з цих центрів емісії змінюється. Водночас, як до, так і після радіяційного опромінення плівок, основна частка випромінення пов'язана з наявністю на поверхні TiO₂ заряджених кисневих вакансій.

Можна відмітити, що присутність заряджених кисневих вакансій та автолокалізованих екситонів призводить до рекомбінації фотоґенерованих носіїв зарядів. Залежно від флюенсу йонного опромінення спектри ФЛ в цілому та їх компоненти, зв'язані з різними центрами випромінення, змінюються складним чином. Разом з тим, інші типи власних дефектів структури наночастинок TiO_2 , присутність яких впливає на оптичне вбирання в межах забороненої зони, участі у випроміненні не приймають.

Цікаво вияснити, як змінюється Φ Л плівок TiO₂ з наночастинками шляхетних металів Ag, Au при йонному опроміненні з різними флюенсами.

Спектри ФЛ для нанокомпозитної плівки TiO_2/Ag подібні до спектрів випромінення тонкої плівки TiO_2 (рис. 9). Гасіння ФЛ розпочинається вже при малих флюенсах і лише при флюенсі $1 \cdot 10^{14}$ йон/см²



Рис. 9. Спектри фотолюмінесценції плівки TiO_2/Ag у вихідному стані до (1) та після йонного опромінення з флюенсами: $1 \cdot 10^{12}$ (2), $1 \cdot 10^{13}$ (3), $1 \cdot 10^{14}$ (4), $1 \cdot 10^{15}$ йон/см² (5).

інтеґральна ФЛ несуттєво перевищує аналогічне значення для неопроміненої плівки TiO₂/Ag.

Переважною є інтенсивність компоненти, що відповідає F-центрам випромінення (рис. 10). Водночас, внесок у випромінення від F-центру емісії та внаслідок рекомбінації автолокалізованих екситонів більш значний, ніж у плівках ТіO₂. Особливо помітним є внесок від F^+ -центрів при флюенсах $1 \cdot 10^{12}$ і $1 \cdot 10^{14}$ йон/см². Має місце змі-



Рис. 10. Розклад спектрів фотолюмінесценції плівки TiO_2/Ag на Ґавсові компоненти до (*a*) та після йонного опромінення з флюенсами: $1 \cdot 10^{12}$ (*б*), $1 \cdot 10^{13}$ (*в*), $1 \cdot 10^{14}$ (*г*), $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² (*д*).



Рис. 11. Спектри фотолюмінесценції плівки TiO_2/Au : вихідний стан до (1) та після йонного опромінення з флюенсами $1 \cdot 10^{12}$ (2), $1 \cdot 10^{13}$ (3), $1 \cdot 10^{14}$ (4), $1 \cdot 10^{15}$ йон/см² (5).

щення компонент емісії, зв'язаних з присутністю заряджених кисневих вакансій, яке подібне до того, що спостерігалось для плівки TiO₂.

Спектри випромінення для плівки TiO_2/Au (рис. 11) мають подібний вигляд до спектрів ФЛ плівок TiO_2 та TiO_2/Ag . При підвищені флюенсів, крім значення $1 \cdot 10^{14}$ йон/см², спостерігається гасіння ФЛ, як і у випадку плівки TiO_2/Ag .

Компоненти ФЛ, як видно з рис. 12, що відповідають Ті³⁺, F^+ і Fцентрам випромінення, а також рекомбінації автолокалізованих екситонів відіграють значну роль у зміні емісії для різних флюенсів. Помітно, що в плівках TiO₂/Au в порівнянні з плівками TiO₂ і TiO₂/Ag, випромінення від F-центрів значно менше, оскільки збільшується випромінення від F^+ -центрів та внаслідок рекомбінації автолокалізованих екситонів.

Очевидно, що рекомбінація фотоґенерованих носіїв заряду погіршує фотоактивність наночастинок TiO_2 , але в процесах релаксації електронних збуджень частина власних дефектів структури не приймає участь у випроміненні. Як було показано з досліджень ОП, не меншу, а, можливо, і більш важливу роль відіграють інші власні дефекти структури, концентрація яких, особливо F^{2+} -центрів, суттєво змінюється залежно від флюенсу йонного опромінення. З цих досліджень витікає, що не можна виділити лише один тип дефектів, який визначає фотокаталітичну активність тонких плівок з наночастинками TiO₂. Фотоактивність TiO₂ визначається присутністю різних типів дефектів, що перебудовуються за наявности в плівках TiO₂ наночастинок шляхетних металів та через зміну флюенсів радіяційного опромінення.

Щоб встановити фотоактивність плівок TiO_2 та TiO_2/Au , TiO_2/Ag



Рис. 12. Розклад спектрів фотолюмінесценції плівки TiO_2/Au на Ґавсові компоненти до (*a*) та після йонного опромінення з флюенсами: $1 \cdot 10^{12}$ (*б*), $1 \cdot 10^{13}$ (*в*), $1 \cdot 10^{14}$ (*г*), $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² (*д*).

до та після радіяційної модифікації різними флюенсами, можна визначити швидкість розпаду органічних речовин при їх освітленні УФ-світлом.

3.3. Фотокаталітична активність плівок TiO₂, TiO₂/Ag, TiO₂/Au до та після радіяційної модифікації йонами Ti⁺

Фотокаталітична активність плівок TiO₂, TiO₂/Ag, TiO₂/Au визначалась за розкладом барвника родаміну Б (РБ) при дії УФ-світла.

Має місце збудження електронів валентної зони в зону провідности при опроміненні TiO₂ УФ-світлом. Частина електронів зони провідности TiO₂ захоплюється молекулями кисню, з утворенням кисневих радикалів, а частина рекомбінує. Дірки валентної зони формують поверхнево зв'язані ОН-радикали при окисненні поверхневих ОН-груп та поверхневих молекуль води [13]. Відокремлення зарядів на TiO₂ визначає ефективність розкладу РБ при опроміненні УФсвітлом. Наночастинки металів на поверхні діоксиду титану можуть виступати центрами відокремлення зарядів [14, 15]. Процес переносу електрона із зони провідности ТіО, до металів є термодинамічно можливим, тому що рівень Фермі діоксиду титану є значно нижчим, ніж для срібла [14]. У місцях контакту метал-напівпровідник відбувається формування бар'єру Шотткі, який покращує процес відокремлення зарядів, а отже фотокаталітичну активність TiO₂. Необхідно мати на увазі, що наявність срібла сприяє збільшенню ймовірности захоплення дірок великим числом неґативно заряджених наночастинок Ag на поверхні TiO₂, що може вести до зниження його активности [13-15].

На рисунку 13 показано кінетичні криві фоторозкладу РБ за участю плівки TiO_2 . Розрахована з цих кривих константа швидкости фоторозкладу барвника становить $2,0\cdot10^{-3}$ хв⁻¹. Після бомбардування йонами Ti^+ з незначним флюенсом (10^{12} йон/см²) розклад барвника значно збільшується. При флюенсах 10^{13} і 10^{14} йон/см² константи швидкости фоторозкладу близькі до значень неопроміненої плівки TiO_2 .

Йонне бомбардування зі значним флюенсом (5·10¹⁴ йон/см²) призводить до того, що константа швидкости досягає рівня, який має



Рис. 13. Кінетичні криві фоторозкладу барвника родаміну Б за участю плівки TiO_2 у вихідному стані (1) та після йонного опромінення (E = 140 кеВ) з флюенсами $1 \cdot 10^{12}$ (2), $1 \cdot 10^{13}$ (3), $1 \cdot 10^{14}$ (4), $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² (5), а також без використання плівки (яловий дослід) (6).

місце за відсутности фотокаталізатора (яловий дослід).

На відміну від плівки TiO₂, застосування у фотокаталізі плівки TiO₂/Ag (рис. 14) призводить до найбільшої константи швидкости при найвищому значенні флюенсу (5·10¹⁴ йон/см²). Якщо опромінення флюенсом 1·10¹³ йон/см² і 1·10¹⁴ йон/см² мало змінюють кон-



Рис. 14. Кінетичні криві фоторозкладу барвника РБ за участю плівки TiO_2/Ag у вихідному стані (1) та після йонного опромінення з флюенсами $1\cdot 10^{12}$ (2), $1\cdot 10^{13}$ (3), $1\cdot 10^{14}$ (4), $5\cdot 10^{14}$ йон/см² (5).

ТАБЛИЦЯ 4.	Кінетичні і	параметри	процесу	фоторозкладу	PБ,	обчислен	ів
наближенні п	севдопершо	го порядку	у реакції.				

Плівка	Константа швидкости k , хв ⁻¹	$t_{\scriptscriptstyle S}$, хв
Яловий дослід	$0,7 \cdot 10^{-3}$	1055
${ m TiO}_2$ (до опромінення)	$2,0.10^{-3}$	350
$\mathrm{TiO}_2~(1{\cdot}10^{12}$ йон/см 2)	$2,6 \cdot 10^{-3}$	270
${ m TiO}_2~(1{\cdot}10^{13}$ йон/см $^2)$	$1,9 \cdot 10^{-3}$	350
$\mathrm{TiO}_2~(1{\cdot}10^{14}$ йон/см 2)	$2,0.10^{-3}$	365
$\mathrm{TiO}_2~(5{\cdot}10^{14}$ йон/см 2)	$0,6 \cdot 10^{-3}$	1070
TiO ₂ /Ag (до опромінення)	$1,5 \cdot 10^{-3}$	480
${ m TiO_2/Ag}$ (1 $\cdot 10^{12}$ йон/см 2)	$3,0.10^{-3}$	235
${ m TiO_2/Ag}~(1{\cdot}10^{13}$ йон/см 2)	$1,7{\cdot}10^{-3}$	420
${ m TiO_2/Ag}~(1{\cdot}10^{14}$ йон/см 2)	$1,9 \cdot 10^{-3}$	370
${ m TiO_2/Ag}~(5{\cdot}10^{14}$ йон/см 2)	$5,0.10^{-3}$	140
TiO ₂ /Au (до опромінення)	$1,4 \cdot 10^{-3}$	500
TiO₂/Au (1·10 ¹² йон/см ²)	$1,8 \cdot 10^{-3}$	380
TiO ₂ /Au (1·10 ¹³ йон/см ²)	$2,0.10^{-3}$	330
${ m TiO_2/Au}~(1{\cdot}10^{14}$ йон/см 2)	$1,4{\cdot}10^{-3}$	$\boldsymbol{495}$
TiO ₂ /Au (5·10 ¹⁴ йон/см ²)	$0,9 \cdot 10^{-3}$	700

станту швидкости і порівняно з використанням неопроміненої плівки TiO_2/Ag , то опромінення з флюенсом $1\cdot 10^{12}$ йон/см² значно підвищує її величину.

Опромінення йонами плівок TiO₂/Au також суттєво змінює константи швидкости фоторозкладу PБ. Найбільшими вони є при флюенсах $1 \cdot 10^{12}$ і $1 \cdot 10^{13}$ йон/см². У випадку найвищого флюенсу ($5 \cdot 10^{14}$ йон/см²) константа швидкости стає меншою, ніж при застосуванні неопроміненої плівки TiO₂/Au.

Кінетичні параметри процесу фоторозкладу РБ, обчислені в наближенні псевдопершого порядку реакції, подано в табл. 4. Результатами розрахунків є константи швидкости реакції k та час напіврозкладу t_s барвника. Як вже відзначалось, має місце зниження активности для зразків з металами до опромінення, що може бути наслідком значних розмірів наночастинок золота і срібла та екрануванням ними великої частини поверхні плівки каталізатора.

З розгляду значень k та t_s видно, що включення наночастинок шляхетних металів Ag і Au призводить до погіршення фотоактивности TiO₂. Водночас, видно, що залежно від величини флюенсу йонного опромінення, можна змінювати кінетичні параметри процесу фоторозкладу в широких межах. Так, для плівки TiO₂ ці параметри значно покращуються при флюенсі $1 \cdot 10^{12}$ йон/см² і суттєво погіршуються при флюенсі $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² в порівнянні з неопроміненим зразком. Для плівки TiO₂/Ag покращення вказаних параметрів має місце при всіх флюенсах, а при флюенсах $1 \cdot 10^{12}$ йон/см² і $5 \cdot 10^{14}$ йон/см² значення цих параметрів значно більше, ніж для плівки TiO₂. Для плівки TiO₂/Au підвищення кінетичних параметрів відбувається при флюенсах $1 \cdot 10^{12}$ йон/см² (рис. 15) Разом з тим, ці параметри вказують, що йонне опромінення мен-



Рис. 15. Кінетичні криві фоторозкладу барвника РБ за участю плівки TiO_2/Au у вихідному стані (1) та після йонного опромінення з флюенсами $1 \cdot 10^{12}$ (2), $1 \cdot 10^{13}$ (3), $1 \cdot 10^{14}$ (4), $5 \cdot 10^{14}$ (5).

шою мірою впливає на покращення фотокаталітичної активности цих плівок у порівнянні з плівками TiO₂ і TiO₂/Ag.

Таким чином, показано, що включення наночастинок шляхетних металів не завжди призводить до покращення кінетичних параметрів фоторозкладу барвника РБ. Опромінення йонами може як покращувати, так і погіршувати фотокаталітичні властивості плівок TiO₂ і TiO₂/Au, або лише покращувати ці властивості, як видно для плівок TiO₂/Ag. Разом з тим, можна підібрати оптимальні флюенси йонного опромінення, за яких відбувається суттєве покращення кінетичних параметрів фоторозкладу органічних речовин.

Порівнюючи результати фоторозкладу барвника РБ з дослідженнями оптичної провідности та фотолюмінесценції, можна відмітити, що значну роль у сенсибілізації фотоактивности відіграють власні дефекти структури наночастинок TiO₂ та їх модифікація опроміненням високоенергетичними бомбівними частинками. Це обумовлено присутністю в TiO₂ заряджених F^+ - і F-центрів, природа яких під дією опромінення та в присутності металів може змінюватись.

Виявляється, що фотоґенерація носіїв зарядів, їх відокремлення, релаксація електронних збуджень не зв'язані з одним з факторів, який би міг бути визначальним у покращенні фотокаталітичної активности плівок TiO_2 . Водночас, очевидно, що суттєвий вплив на кінетику фотокаталітичного розкладу речовин виявляють сукупність різноманітних факторів, в якій значну роль відіграють різні типи власних дефектів та їх модифікація радіяційним опроміненням та наночастинками шляхетних металів Au, Ag.

4. ВИСНОВКИ

Дослідження спектральної залежности оптичної провідности $\sigma(E)$ плівок TiO₂, TiO₂/Au, TiO₂/Ag вказує на присутність в межах забороненої зони власних дефектів структури: F^{2+} , F- і F^+ - центрів, йонів Ti³⁺ та міжвузлових атомів Ti в тетраедричних та октаедричних порах ґратниці анатазу. Опромінення цих плівок йонами Ti⁺ ($E_i = 140$ кеВ) з флюенсами 1·10¹², 1·10¹³, 1·10¹⁴, 5·10¹⁴ йон/см² призводить до суттєвої трансформації дефектної структури, яка значним чином відрізняється для чистої плівки TiO₂ та плівки з металами. Значна перебудова спектральної залежности ОП $\sigma(E)$ свідчить про складні процеси фотоґенерації носіїв зарядів, їх відокремлення, рекомбінації електрон-діркових пар, які можуть суттєво змінюватися залежно від типу плівок та їх дозового навантаження при йонному опроміненні.

Спектри фотолюмінесценції плівок вказують на випромінення у видимому діяпазоні зумовлене наявністю Ti^{3+} , *F*- і *F*⁺-центрів та рекомбінацією автолокалізованих екситонів. Роль указаних центрів рекомбінації значним чином залежить від наявности в плівках наночастинок шляхетних металів та дози вбирання йонного опромінення. Для кожної з плівок існують оптимальні флюенси опромінення, за яких має місце найбільше гасіння фотолюмінесценції, що може впливати на фотокаталітичну активність плівок.

Кінетичні параметри фоторозкладу барвника родаміну Б (константа швидкости фоторозкладу і час напіврозкладу) значно відрізняються для чистих плівок TiO_2 і модифікованих наночастинками Au, Ag до та після йонного опромінення з різними флюенсами. Найбільш оптимальним є флюенс у $1 \cdot 10^{12}$ йон/см², при якому всі плівки показали вище значення кінетичних параметрів. Саме при такому значенні флюенсу сукупність характеристик плівок, яка включає природу власних дефектів анатазу, відповідні електронні переходи, що впливають на фотоґенерацію носіїв зарядів, релаксацію електронних збуджень, відокремлення електрон-діркових пар, визначає механізми покращення фотокаталітичних властивостей тонких плівок TiO₂.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- 1. M. Epifani, C. Giannini, L. Tapfer, and L. Vasanelli, *Journal of the American Ceramic Society*, 83, No. 10: 2385 (2000).
- 2. Н. В. Вітюк, Г. М. Єременко, Н. П. Смірнова, П. П. Горбик та ін., *Фізика і хімія твердого тіла*, **8**, № 4: 776 (2007).
- 3. Н. Вітюк, Я. Дивінський, Н. Смірнова, Г. Єременко, О. Оранська, Хімія, фізика та технологія поверхні, 9: 76 (2003).
- 4. Wan-Jian Yin, Shiyou Chen, Ji-Hui Yang et al., *Applied Physics Letters*, **96**: 221901 (2010).
- 5. J. Chem, L.-B. Lin, F. Q. Jing, J. Phys. Chem. Solids, 62: 1257 (2001).
- 6. P. Jeske, G. Haselhorst, T. Weyhermuller, K. Wieghart, and B. Nuber, *Inorg. Chem.*, **33**, No. 11: 2462 (1994).
- J. Nowotny, T. Bak, M. K. Nowotny, L. R. Sheppard, J. Phys. Chem. B, 110: 18492 (2006).
- 8. А. А. Лисаченко, В. Н. Кузнецов, М. Н. Захаров, Р. В. Михайлов, *Кинетика* и катализ, **45**, № 2: 205 (2004).
- 9. N. Daude, C. Gout, and C. Jouanin, Phys. Rev. B, 15: 3229 (1977).
- 10. N. Serpone, D. Lawless, and R. Khairutdinov, *J. Phys. Chem.*, **99**: 16646 (1995).
- 11. Т. О. Буско, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш та ін., ВАНТ, 98, № 4: 3 (2011).
- 12. Jin Jun, M. Dhayal, J.-H. Shin, J.-C. Kim, and N. Getoff, *Rad. Phys. and Chem.*, **75**: 583 (2006).
- 13. Ю. І. Гнатюк, Є. В. Мануйлов, Н. П. Смірнова, Γ. М. Єременко, *Φізика і хі*мія твердого тіла, **7**: 107 (2006).
- 14. C. He, Y. Yu, X. Hu, and A. Larbot, Appl. Surf. Sci., 200: 239 (2002).
- 15. H. Sung-Suh, J. Choi, H. Hah, S. Koo, and Y. Bae, *J. Photochem. Photobiol. A*, **163**: 37 (2004).